



## Europass автобиография

### Лична информация

Собствено (и) име (на) /  
Фамилия(и)

**Радостин Русев**

Офис адрес  
Адрес за кореспонденция

ТУ-София, бл. 1, каб. 1113, бул. Климент Охридски 8, София 1797  
София 1784,

Телефон

e-mail

r.rusev@tu-sofia.bg

Националност

Българин

Дата на раждане

### Трудов стаж

5 години (към 2022 г.)

Дати

2022 – до сега

Заемана длъжност или позиция

**асистент**

кат. „Микроелектроника“, Факултет по електронна техника и технологии

Дати

2017– до сега

Заемана длъжност или позиция

**Експерт МИНОЛаб“**

Микро нано лаборатория, СНИРД, София Тех Парк

<https://sofiatech.bg>

Преподавателска дейност

- Цифрови интегрални технологии
- САD за проектиране на интегрални схеми
- Микроелектроника

Научноизследователски тематики

- Проектиране на интегрални схеми и печатни платки

## Образование и обучение

Дати	2020
Придобита квалификация	<b>Доктор (PhD) по научна специалност „Микроелектроника“</b>
Основни предмети/застъпени професионални умения	
Име и вид на обучаващата или образователната организация	<u>Технически университет – София</u> <a href="http://www.tu-sofia.bg/index.html">http://www.tu-sofia.bg/index.html</a>
Ниво по националната класификация	образователна и научна степен „доктор“
Дати	2017-2019
Придобита квалификация	<b>Магистър, специалност „Микротехнологии и наноинженеринг“</b>
Основни предмети/застъпени професионални умения	Тема на дипломната работа: Откриване, класификация и изследване на дефекти в печатни платки при запояване чрез ръонтгенов анализ и анализ на разрушителното напрежение на срязване
Име и вид на обучаващата или образователната организация	<u>Технически университет – София</u> <a href="http://www.tu-sofia.bg/index.html">http://www.tu-sofia.bg/index.html</a>
Дати	2013 – 2017
Придобита квалификация	<b>Бакалавър, специалност „Електроника“</b> специализации: Микроелектроника
Основни предмети/застъпени професионални умения	Тема на дипломната работа: Проектиране на GPS устройство за проследяване на животни
Име и вид на обучаващата или образователната организация	<u>Технически университет – София</u> <a href="http://www.tu-sofia.bg/index.html">http://www.tu-sofia.bg/index.html</a>
Ниво по националната класификация	образователно-квалификационна степен „бакалавър“

**Лични умения и компетенции**

Майчин (и) език (езици)

Чужд (и) език (езици)

Самооценяване

Европейско ниво (\*)

**Английски****Руски****Български**

Английски, руски,

Разбиране				Разговор				Писане	
Слушане		Четене		Участие в разговор		Самостоятелно устно изложение			
A2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене
A2	Основно ниво на владееене	C2	Основно ниво на владееене	B2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене	A2	Основно ниво на владееене

(\*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции

- Научноизследователски умения и компетенции: дългогодишна научноизследователска работа в изследване на дефекти с микро и нано размери в електронна апаратура
- Преподавателски умения: лабораторни упражнения и семинарни упражнения
- Работа в екип в различни изследователски и бизнес екипи

Организационни умения и компетенции

Работа в екип в научноизследователски дейности

Технически умения и компетенции

Дългогодишен опит в изследването на дефекти в интегрални схеми: Работа с рьонтгенов микроскоп (X-Ray), сканиращ акустичен микроскоп (SAM), химическо ецване, плазмено ецване, емисионна микроскопия (EMMI), напрежение на срязване върху електронен компонент, изготвяне на топологичен чертеж и опроводяване на печатни платки

Компютърни умения и компетенции

- Операционни системи: Windows, Windows и Linux
- CAD системи за проектиране на интегрални схеми: Cadence, Synopsis, Mentor Graphics и Altium Designer
- Математически пакети: Matlab
- Друг инженерен софтуер: Autodesk AutoCAD и COMSOL

Други умения и компетенции

Спорт

Свидетелство за УМПС

Не

**Допълнителна информация**

Автор на 2 (2 в Scopus), цитирания 3 (Scopus); h-index 1 (Scopus)  
Член на IEEE (<http://www.ieee.org/index.html>)